

| 标准详细信息   |  |
|----------|--|
| 标准状态     | 现行   |
| 标准编号     | T/CECA 112.2—2025  |
| 中文标题     | 表面安装多层陶瓷电容器（MLCC）电性能老化测试方法第2部分：长周期高温绝缘电阻测试   |
| 英文标题     | The electrical performance aging test method for surface mount multi-layer ceramic capacitors (MLCC) — Part 2: Long-term insulation resistance test at high temperature        |
| 国际标准分类号  | ICS 31.060.10  |
| 中国标准分类号  | CCS L 11   |
| 发布日期     | 2025 - 08 - 25   |
| 实施日期     | 2025 - 08 - 28   |
| 起草单位     | 广东风华高新科技股份有限公司、广东微容电子科技有限公司、潮州三环(集团)股份有限公司、大连达利凯普科技股份公司、福建火炬电子科技股份有限公司、深圳市宇阳科技发展有限公司、武汉佰力博科技有限公司、成都宏科电子科技有限公司、北京元六鸿远电子科技股份有限公司、杭州灵通电子有限公司、华为技术有限公司、广东高端元器件创新科技有限公司             |
| 起草人      | 付振晓、陈涛、朱璇、王彬彬、杨俊、方辉、孙飞、林森、阮丽梅、胜鹏、陈驰、晏发生、梁静玲  |
| 主要技术内容   | <p>本文件描述了表面安装多层陶瓷电容器（以下简称 MLCC）长周期高温绝缘电阻测试（以下简称 Hot IR 测试）的测试原理，规定了样品的测试步骤。</p> <p>本文件适用于电子设备中使用且用于表面安装的 1 类和 2 类 MLCC。这些电容器为无包封设计，带金属连接片或焊接带，主要应用于印制电路板（PCB）或在混合电路上的直接安装。</p> |
| 是否包含专利信息 | 否  |
| 标准文本     | 不公开  |